2021B1735

BL04B2

エチドロン酸Ⅱナトリウムにおける構造解析 ② Structure Analysis of Etidronate Disodium ②

<u>島倉 宏典</u>^a, 橋塚 貴彦^b, 尾原 幸治^c <u>Hironori Shimakura</u>^a, Takahiko Hashidsuka^b, Koji Ohara^c

^a 新潟薬科大学,^b 大日本住友製薬(株),^c (公財)高輝度光科学研究センター ^a NUPALS,^b Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.,^c JASRI

より安定なアモルファス製剤の開発を目的として、骨代謝改善剤ダイドロネルの主成分である エチドロン酸IIナトリウムの合成法に依存した構造差異について検討を行った。今回測定した試 料は四水和物結晶、無水物結晶、加熱法により作成したアモルファス、及び凍結乾燥法で作成し たアモルファスであり、それらについて BL04B2 のX線全散乱を用いて解析した。測定試料は石 英キャピラリに封入し透過法で測定を行い、良質な全散乱データを取得した。全二体相関関数の 結果から、四水和物結晶と無水和物結晶では、4.0–5.0Åというエチドロン酸分子同士の相関に関 係する領域での構造が異なること、各手法で作成したアモルファス間では7.0–8.0Åという中、長 距離相関距離に違いが表れることが分かった。今後構造モデルを構築し、より詳細な構造の差異 について検討を行っていく。

キーワード: アモルファス製剤、X線全散乱測定、PDF解析

背景と研究目的:

難溶性薬剤はアモルファス化することでその溶解度を向上させることができ、医薬品開発において広く利用されている。ゆえに、安定なアモルファスの作成は重要であり、アモルファスの安定化に影響を与える因子を解明する必要がある。その一方で、医薬品の主成分は分子であるため、分子内構造と分子間構造の変化を同時に解析する必要がある。

本研究はエチドロン酸IIナトリウム(ダイドロネル)のアモルファス分子構造の構造研究である。 医薬品はその構造の安定性や結晶転移による薬効の変化予防などの観点から安定な結晶形を原薬 として使用してきた。しかし、エチドロン酸IIナトリウムは現在アモルファス状態を原薬として 販売されており、生成手法によりアモルファスの安定性や分子形に差が生じている。これらアモ ルファス製剤の安定性を評価する方法はその形状の医薬品の増加に伴い、従来の熱分析や長期安 定性試験だけでなく、分子運動性に基づく物理的安定性の予測などが行われており[1]、多くのア モルファス製剤にも利用可能な手法の確立が求められている。本研究では実際に得られたアモル ファス製剤の構造を直接測定し、実験結果に合う構造モデルの構築を行うため、湿度や温度など の外部の因子による結晶化可能性の予測を行う基礎的な知見になる。

実験:

測定試料は、四水和物結晶とそれを加熱することで作成したアモルファス、アモルファスをさらに加熱させることで得られる無水物結晶及び水溶液から凍結乾燥法で作成したアモルファスの4つである。作成した試料は外形 2 mm の石英製キャピラリに詰め、トールシールによる封止を行った。

X線全散乱測定は高エネルギーX線ビームライン BL04B2 を使用して実施し、測定にはSi湾曲 分光結晶の220反射により61.4 keV に単色化された入射X線を使用した。試料からの散乱X線 は、約8°おきに配置されたCdTeおよびGe検出器で測定し、測定した角度は0.3-48°であり、測 定波数領域は0.2-25.5Å⁻¹であった。試料チャンバー内を真空排気することにより試料周りにお ける空気散乱によるバックグラウンドを抑えた。高波数領域における十分な散乱強度を確保する ことを目的とし、入射X線の形状は2.0 (height)×2.0 (width) mm²程度とした。測定は全て室温で 行い、石英製キャピラリからのバックグラウンドを取り除くため、空のキャピラリの測定も行っ た。測定時間は十分な統計を得るために1試料あたり2時間程度とした。

結果および考察:

Fig. 1 はエチドロン酸(II) ナトリウム四 水和物結晶と無水物結晶の構造因子 *S(Q)* 及びBarnetら[2]によって報告された四水和 物結晶構造を基に計算した構造因子を示し たものである。今回測定した四水和物結晶 はほぼ Barnett らによって報告された構造 と同様のスペクトルを示していることか ら、今回使用した四水和物結晶が Barnett ら のモデルに近いものを示していることがわ かる。

Fig. 2 に四水和物結晶及び無水物結晶の 構造因子から計算した減衰二体分布関数 G (r)を示す。4.0 Å 以下の距離にある分子形 状と関係するピークにはほとんど変化はな く、エチドロン酸分子の構造に変化がない ことがわかる。その一方で、4.0 Å 以上の分 子間距離に相当する領域では、四水和物結 晶と無水物結晶との間に違いが表れている ことがわかる。特に、無水物結晶において は4.0-5.0 Å の位置にピークが表れており、 エチドロン酸分子同士の配置に違いが表れ ていることがわかる。

Fig. 3 に加熱法で作成したアモルファス 試料および凍結乾燥法で作成したアモルフ ァスの構造因子 *S(Q)*を示す。どちらの試料 においても、高波数空間までブラッグピー クが観測されておらず、アモルファス試料 が得られていることがわかる。また、分子 形状を反映する高波数領域の構造因子はほ ぼ変化がなかったものの、中距離、長距離 相関を示す低波数領域においては第一、第 ニピークの強度とその位置に違いが表れて いることがわかった。

Fig. 4 に中距離相関の違いを明確にする ために減衰二体分布関数 G(r) と距離 r の 積をとったものを示す。どちらのアモルフ ァスにおいても 4.0-5.0 Å にピークが表れ ており、エチドロン酸分子の周辺構造は四 水和物結晶と比べ、無水物結晶に近い構造 となっていることがわかる。また、7.0-8.0 Å のピーク形状が異なっていることから、ア モルファス間でも中、長距離構造に違いが 出ている可能性が考えられる。



Fig. 1 実験から得られたエチドロン酸ナトリウム四水 和物、無水物結晶及び Barnet ら[2] によって報 告された四水和物結晶構造から計算した構造因 子 S(Q)。



Fig. 2 エチドロン酸ナトリウム無水物、四水和物結晶の 減衰二体分布関数 *G*(*r*)。



Fig. 3 加熱法と凍結乾燥法で作成したアモルファ スの構造因子 *S*(*Q*)



 Fig. 4
 加熱法と凍結乾燥法で作成したアモルファスの減衰二体分布関数×距離 rG(r)。

今後の課題:

本課題の実施により、広い波数領域にわたって良好なS/N 比の構造因子を得ることに成功した。 また、サンプルによって中距離相関が異なることが示唆された。今後は実験データを再現する構 造モデルを構築することで、その中距離相関の違いを明らかにしていく。

参考文献:

[1] E. Yonemochi, Cryobiology and Cryotechnology, 51 (2005) 25.

[2] B. L. Barnett, L. C. Strickland, Acta Crystallographica, Section 35 (1979) 1212.